

张家港砷化镓芯片SEM表面分析 晶片表面损伤分析

产品名称	张家港砷化镓芯片SEM表面分析 晶片表面损伤分析
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

砷化镓分析范围

砷化镓电池，砷化镓芯片，砷化镓太阳能电池，砷化镓衬底，砷化镓薄膜，砷化镓晶体，砷化镓半导体，砷化镓外延片等。

分析项目：晶片表面损伤分析，表面清洗及SEM表面分析，含量分析，晶胞结构分析，位错密度分析，表面缺陷分析，载流子浓度分析，红外吸收分析等。

砷化镓分析标准

GB/T 8757-2006砷化镓中载流子浓度等离子共振测量方法

GB/T 8758-2006砷化镓外延层厚度红外干涉测量方法

GB/T 8760-2020砷化镓单晶位错密度的测试方法

GB/T 11068-2006砷化镓外延层载流子浓度电容-电压测量方法

GB/T 11093-2007液封直拉法砷化镓单晶及切割片

GB/T 11094-2020水平法砷化镓单晶及切割片

GB/T 17170-2015半绝缘砷化镓单晶深施主EL2浓度红外吸收测试方法

GB/T 18032-2000砷化镓单晶AB微缺陷检验方法

GB/T 19199-2015半绝缘砷化镓单晶中碳浓度的红外吸收测试方法

GB/T 20228-2006砷化镓单晶

GB/T 20228-2021砷化镓单晶

GB/T 25075-2010太阳能电池用砷化镓单晶

GB/T 30856-2014LED外延芯片用砷化镓衬底

GB/T 35305-2017太阳能电池用砷化镓单晶抛光片

SJ 3242-1989砷化镓外延片

SJ 3248-1989重掺砷化镓和磷化铟载流子浓度的红外反射测试方法

SJ 3249.3-1989半绝缘砷化镓中铬浓度的红外吸收测试方法

SJ/T 11488-2015半绝缘砷化镓电阻率、霍尔系数和迁移率测试方法

SJ/T 11490-2015低位错密度砷化镓抛光片蚀坑密度的测量方法

SJ/T 11496-2015红外吸收法测量砷化镓中硼含量

SJ/T 11497-2015砷化镓晶片热稳定性的试验方法

SJ 20635-1997半绝缘砷化镓剩余杂质浓度微区试验方法

SJ 20713-1998砷化镓用高钝镓中铜、锰、镁、钒、钛等12种杂质的等离子体光谱分析法

SJ 20714-1998砷化镓抛光片亚损伤层的X射线双晶衍射试验方法

SJ 21536-2018微波功率器件及集成电路用砷化镓外延片规范